

談話室

日韓交流 The 11th Korean Symposium on Surface Analysis (KoSSA-11) 参加報告

伊藤 博人*

コニカミノルタ株式会社 開発統括本部 A&S センター 分析技術室

〒191-8511 東京都日野市さくら町1 番地

*Hiroto.ito1@konicaminolta.com

(2015年11月2日受理)

2014年から実施している日韓交流の一環として、2015年10月6日から8日に韓国の Daemyung Resort Byeonsam で開催された The 11th Korean Symposium on Surface Analysis (KoSSA; <http://kossa.kriss.re.kr/>) に参加した。開催地の Byeonsam は韓国の南西に位置する風光明媚な土地である。

KoSSA 参加に先立ち、10月6日の午前中、KRISS の Kyung Joong Kim 博士の研究室を見学させていただいた。GCIBを備えた XPS 装置、磁場型の D-SIMS 装置、製膜装置と直結した XPS 装置、が整備の行き届いた良好な環境の実験室に設置されており、これらの設備を活用し、標準試料の検討、量子ドットを活用した太陽電池の研究が行われているとのことである。研究室見学の後、Byeonsam に移動、当日の夜は蟹料理にて親交を深めた。

10月6日午後から開催されたシンポジウムでは100名程度の参加者があり、以下の6つのセッションにおいて19件の口頭講演が行われた。



Fig.1 Ito's lecture at this symposium.

Session 1 : Secondary Ion Mass Spectrometry

Session 2 : Electron Spectroscopy

Session 3 : Imaging Technology

Session 4 : Novel Technology

Session 5 : Application 1 (Bio & Organic)

Session 6 : Application 2 (Semiconductor & Metal)

SASJ からは Session 1 において、コニカミノルタの伊藤が「Practical Surface Chemical Analysis of Organic Materials using TOF-SIMS」というタイトルで TOF-SIMS を有機材料の評価に活用した実用的な事例と、SASJ の TOF-SIMS ワーキンググループ活動として実施している、実用的な質量校正手順に関する検討結果を報告した。また、Session 2 において、沖縄科学技術大学院大学の石津が「Depth-Profiling Working Group in Surface Analysis society of Japan」というタイトルで SASJ の Depth Profile ワーキンググループの活動内容を報告した。この他、日本からはアルバック・ファイ株式会社の井上氏からラボで活用できる硬 X 線光電子分光装置の開発状況の報告があった。口頭発表の中では、いわゆる表面分析だけでなく、超解像顕微鏡、ナノ粒子を用いたバイオ系試料への取り組みについての報告もあり、最近の傾向をとらえたプログラム編成が感じられた。

10月7日にはポスターセッションも開催され、34件のポスター発表があった。ポスターセッションでもバイオ系試料への取り組みが多数発表されており、世界の流れを意識した取り組みが感じられた。

今回の日韓交流プログラムでは KRISS の Kyung Joong Kim 博士、Jeong Won Kim 博士とその研究室の皆さんに滞在中の諸事全般にわたり、人情味あふれ献身的なホスピタリティーで出迎えていただいた。

心から感謝する次第である.

韓国では来年 2016 年 10 月 Daejeon にて PSA-16 が開催される他, 8 月には Busan にて 20th INTERNATIONAL VACUUM CONGRESS (IVC-20) が開催される予定である. さらなる交流が期待される.